

**日本信頼性学会
第27回秋季信頼性シンポジウム
プログラム**

(敬称略)

日時：2014年11月19日(水) 10:10~19:00

場所：一般財団法人日本科学技術連盟 千駄ヶ谷本部ビル

	第1会場(3号館2階講堂)	第2会場(3号館3階C室)
	セッション1 (試験, 故障解析, 部品, 要素技術の信頼性, ハードウェア面(1)) 司会: 根本規生 (独)宇宙航空研究開発機構	セッション4 (システムの信頼性, 保安全性, ライフサイクルおよびソフトウェア面) 司会: 石田 勉 (元日本アイ・ピー・エム株)
10:10~10:35	リチウムイオン二次電池の充放電による容量劣化の予測に関する一考察 ○横川慎二 (職業能力開発総合大学校)	RCMCにおけるオン・コンディション保全とコンディション・モータリング保全への一考察 ○柏井宏太, 金 路, 鈴木和幸 (電気通信大学)
10:35~11:00	部品実装基板のための総合解析システム ○村原大介, 中嶋龍一, 中村隆治, 味岡恒夫, 今井康雄 (沖エンジニアリング株)	複数の故障メカニズムを考慮した状態監視と最適保全方策 ○上野智史, 金 路, 鈴木和幸 (電気通信大学)
11:00~11:25	不揮発メモリの信頼性評価 ○長野真人, 岩井泰之, 小関健哲, 今井康雄 (沖エンジニアリング株)	三相誘導モーターのライフサイクルコスト — 具体的データによるモデルの検証 その5— ○村岡哲也 (第一工業大学), 四本 久 (霧島市役所), 池田弘明 (コンサルタント)
11:25~12:40	昼 食	昼 食
12:40~13:00	会長挨拶 水間 毅 会長	
13:00~14:30	車載用半導体デバイスにおける機能安全への取組み (仮) 安増 貴志 氏 (ルネサス エレクトロニクス株式会社) 司会 長塚 豪己 (中央大学)	
14:30~14:40	休 憩	休 憩
	セッション2 (試験, 故障解析, 部品, 要素技術の信頼性, ハードウェア面(2)) 司会: 横川慎二 (職業能力開発総合大学校)	セッション5 (安全性, リスク) 司会: 岩田浩司 (公財)鉄道総合技術研究所
14:40~15:05	電子機器・電子部品の不再現 ○味岡恒夫 (沖エンジニアリング株), 佐藤博之 (株アドバンテスト), 遠西繁治 (日本電気株)	本質安全設計の考察 ○柴田義文 (安信経営工学研究所)
15:05~15:30	ガスメーター部品のリユース手法の開発 ○小澤由規, 浅田昭治 (大阪ガス株), 西村寛之 (京都工芸繊維大学大学院)	機能安全への日本的品質管理・信頼性工学による一考察 ○海野裕宣, 鈴木和幸 (電気通信大学)
15:30~15:55	製品衝撃強さ試験における統計解析手法 ○中嶋隆勝, 堀口翔伍 (地独)大阪府立産業技術総合研究所)	システムのアプローチに着目した信頼性・安全性の作り込み評価 ○山崎雄大, 鈴木和幸 (電気通信大学)
15:55~16:20	LED電源の信頼性設計とHALT試験 ○末田泰介, 越前谷大介, 馬場文明 (三菱電機株), 前田貴史 (三菱電機照明)	鉄道信号RAMS対応の実際 ○島添敏之 (株京三製作所)
16:20~16:30	休 憩	休 憩
	セッション3 (理論・一般) 司会: 島添敏之 (株京三製作所)	セッション6 (データ収集・解析) 司会: 長塚豪己 (中央大学)
16:30~16:55	電子部品の故障率と故障件数の関係についての考察 (2) ○松岡敏成 (三菱電機株)	ワイプル回帰モデルに基づく信頼性オンラインモニタリングデータの解析 ○大場正寿, 山本 涉, 鈴木和幸 (電気通信大学大学院)
16:55~17:20	温度劣化における最適試験法: 少数サンプルの場合 ○田淵直樹, 廣瀬英雄 (九州工業大学)	使用環境条件の変化に着目したオンライン状態監視による信頼性評価 ○早川敦士, 山本 涉, 鈴木和幸 (電気通信大学大学院)
17:20~17:45	列車検知装置の保全コストに関する考察 (その2) — 設備保全データのモデル化とその活用— ○志田 洋, 大串裕郁 (西日本旅客鉄道株), 樋上喜信, 阿萬裕久, 高橋 寛 (愛媛大学大学院)	ロバストな側面を持つ統計量を用いた外れ値の検定に関する一考察 ○横山真弘, 長塚豪己 (中央大学)
17:50~19:00	情報交流会 (3号館3階D室)	

●タイトルの修正は報文集にて対応いたします。各セッション司会者は変更する場合があります。